



**ПРОГРАММА ШКОЛЫ-СЕМИНАРА  
«РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ 2019»**

<b>Понедельник 24 июня</b>	
<b>09:30-10:00</b>	Регистрация участников - 16 этаж гостиницы Ялта-Интурист
<b>10:00-10:05</b>	<i>Открытие, вступительное слово сопредседателей школы-семинара</i>
<b>10:05-11:30</b>	<b>Дозовые ионизационные эффекты и структурные повреждения в ЭКБ – Таперо К.И. (д.т.н., АО «НИИП»)</b>
<b>11:30-12:00</b>	<i>Кофе пауза</i>
<b>12:00-13:30</b>	<b>Одиночные радиационные эффекты в ЭКБ: от физики к практике испытаний – Емельянов В.В. (АО «НИИП»)</b>
<b>13:30-15:00</b>	<i>Обед*</i>
<b>15:00-15:45</b>	<b>Федеральный сертификационный центр радиационных испытаний – Поротников Л.К. (Госкорпорация «Росатом»)</b>
<b>15:45-16:30</b>	<b>Состояние и перспективы развития нормативной базы радиационных испытаний – Чубунов П.А. (филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»)</b>
<b>21:00-23:00</b>	<b>Приветственный фуршет в ресторане «Bad Place»</b> - 16 этаж гостиницы Ялта-Интурист
<b>Вторник 25 июня</b>	
<b>09:30-10:00</b>	Регистрация участников - 16 этаж гостиницы Ялта-Интурист
<b>10:00-11:00</b>	<b>Практические аспекты подготовки к проведению испытаний на стойкость к воздействию тяжелых заряженных частиц – Бабак Р.П. (Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»)</b>
<b>11:00-11:30</b>	<i>Кофе пауза</i>
<b>11:30-12:30</b>	<b>Методы измерения параметров ЭКБ при воздействии ионизирующих излучений – Озеров А.И. (АО «НИИП»)</b>
<b>12:30-13:30</b>	<b>Эффекты пробоя диэлектрических структур в изделиях полупроводниковой электроники – Митин Е.В. (ООО «НПЦ «Гранат»)</b>
<b>13:30-15:00</b>	<i>Обед*</i>
<b>15:00-15:45</b>	<b>Радиационные эффекты в солнечных батареях – Таперо К.И. (д.т.н., АО «НИИП»)</b>
<b>15:45-16:30</b>	<b>Радиационная стойкость МЭМС – Щепанов А.Н. (ФГУП «МНИИРИП»)</b>

<b>Среда 26 июня</b>	
<b>09:00-19:00**</b>	<p><b>Экскурсия «Древний Судак и винные подвалы Солнечной Долины»</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стоимость экскурсии входит в сумму организационного взноса.</li> <li>- <b>Питание не входит в стоимость экскурсии, участникам необходимо заказать питание в гостинице («ланч бокс»)</b></li> <li>- <b>08:45 встреча гостей на ресепшен в отеле Ялта-Интурист</b></li> </ul>
<b>Четверг 27 июня</b>	
<b>10:00-11:00</b>	<b>Особенности воздействия многократных электростатических разрядов на стойкость ЭКБ – Скоробогатов П.К. (д.т.н., АО ЭНПО «СПЭЛС»/НИЯУ МИФИ)</b>
<b>11:00-11:30</b>	<i>Кофе пауза</i>
<b>11:30-12:30</b>	<b>Моделирование эффектов воздействия излучения ядерного взрыва на ЭКБ и блоки РЭА – Олухов В.М. (к.т.н., АО «НИИП»)</b>
<b>12:30-13:30</b>	<b>Обзор отечественных и иностранных архитектур микропроцессоров для космических применений – Горбунов М.С. (к.т.н., ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН)</b>
<b>13:30-15:00</b>	<i>Обед*</i>
<b>15:00-15:45</b>	<b>Практические аспекты испытаний ЭКБ на воздействие поглощенной дозы с учетом эффектов низкой интенсивности – Петров А.С. (к.т.н., АО «НИИП»)</b>
<b>15:45-16:30</b>	<b>Анализ рисков аномального функционирования РЭА КА при несоблюдении требований по стойкости ЭКБ к воздействию ионизирующих излучений космического пространства – Анашин В.С. (к.т.н., филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»)</b>
<b>Пятница 28 июня</b>	
<b>10:00-11:00</b>	<b>Научная аппаратура регистрации ионизирующих излучений космического пространства – Богомолов В.В. (к.ф.-м.н., НИИЯФ МГУ)</b>
<b>11:00-11:30</b>	<i>Кофе пауза</i>
<b>11:30-12:30</b>	<b>Опыт экспертизы работ по обеспечению стойкости РЭА космической техники: типовые ошибки разработчиков при отступлении от порядка гарантированного обеспечения стойкости – Протопопов Г.А. (к.т.н., филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»)</b>
<b>12:30-13:30</b>	<b>Доклады молодых специалистов</b>
<b>13:30-15:00</b>	<i>Обед*</i>
<b>15:00-16:00</b>	<b>Круглый стол. Взаимодействие испытательных центров и заказчиков испытаний – Козюков А.Е. (филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»)</b>
<i>Заккрытие школы-семинара</i>	

\* Обед не входит в стоимость организационного взноса. Участники, не проживающие в гостинице Ялта-Интурист, решают вопрос питания самостоятельно, в том числе могут воспользоваться кафе на территории Ялта-Интурист.

\*\* Время окончания экскурсии зависит от дорожной ситуации и может незначительно измениться.